This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-284094

(43)公開日 平成11年(1999)10月15日

(51) Int.CL ⁶		識別記号	FΙ		
H01L	23/12		H01L	23/12	J
	23/28			23/28	В
				23/12	L

審査請求 未請求 請求項の数10 OL (全 7 頁)

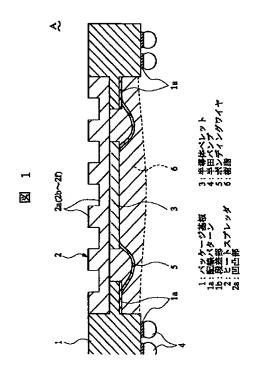
(21)出願番号	特顧平10-80738	(71)出顧人	000005108
			株式会社日立製作所
(22)出顧日	平成10年(1998) 3月27日		東京都千代田区神田駿河台四丁目 6 番地
		(72)発明者	佐々木 主治
			東京都青梅市新町六丁目16番地の3 株式
			会社日立製作所デバイス開発センタ内
		(74)代理人	弁理士 筒井 大和

(54) 【発明の名称】 半導体装置および半導体装置の製造方法

(57)【要約】

【課題】 製造原価低減および外形寸法の小型化と放熱性能の向上とを両立させる。

【解決手段】 パッケージ基板1に固定されたヒートスプレッダ2に半導体ペレット3を固定し、パッケージ基板1に設けられた配線パターン1 aおよびボンディングワイヤ5を介して、半導体ペレット3のボンディングパッドを外部接続電極として機能する半田バンプ4に接続し、半導体ペレット3を樹脂6にて封止した構成の半導体装置において、ヒートスプレッダ2を加工性が良好で安価かつ熱伝導率の高い銅(Cu)等の金属で構成し、当該ヒートスプレッダ2自体の外面にプレス加工等により凹凸部2aを形成して厚さ寸法等を増大させることなく、放熱性能を高めた。



【特許請求の範囲】

.

【請求項1】 任意の機能を有する半導体ペレットを放 熱部材に固定してなる半導体装置であって、前記放熱部 材は凹凸形状を有することを特徴とする半導体装置。

【請求項2】 請求項1記載の半導体装置において、枠 形状を呈し、前記放熱部材の周辺部を支持する枠構造 と、前記枠構造の一部に突設された複数の外部接続電極 と、前記半導体ペレットと前記外部接続電極とを電気的 に接続する配線構造と、を有することを特徴とする半導 体装置。

【請求項3】 請求項2記載の半導体装置において、前 記枠構造はパッケージ基板であり、前記配線構造は、前 記パッケージ基板に設けられ、前記外部接続電極に接続 される配線パターンと、前記配線パターンと前記半導体 ペレットとの間に架設されたボンディングワイヤとから なることを特徴とする半導体装置。

【請求項4】 請求項1の半導体装置において、前記枠 構造は、TABテープであり、前記配線構造は、前記T ABテープ上に設けられ、前記半導体ペレットと前記外 とする半導体装置。

【請求項5】 請求項2、3または4記載の半導体装置 において、前記外部接続電極は、半田バンプからなるこ とを特徴とする半導体装置。

【請求項6】 請求項1,2,3,4または5記載の半 導体装置において、前記半導体ペレットは、ポッティン グ樹脂にて封止されてなることを特徴とする半導体装 置。

【請求項7】 任意の機能を有する半導体ペレットを放 熱部材に固定してなる半導体装置の製造方法であって、 前記放熱部材に凹凸形状を形成する工程を含むことを特 徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項8】 請求項7記載の半導体装置の製造方法に おいて、前記放熱部材を枠状のパッケージ基板に固定す る工程と、前記パッケージ基板に外部接続電極を形成す る工程と、前記外部接続電極と前記半導体ペレットとを 電気的に接続する工程とを任意の順序で行うことを特徴 とする半導体装置の製造方法。

【請求項9】 請求項7記載の半導体装置の製造方法に おいて、前記半導体ペレットをTABテープ上のリード 40 に接続する工程と、前記放熱部材を前記TABテープに 固定する工程と、TABテープに外部接続電極を形成す る工程とを任意の順序で行うことを特徴とする半導体装 置の製造方法。

【請求項10】 請求項8または9記載の半導体装置の 製造方法において、前記半導体ペレットを樹脂で封止す る工程を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。 【発明の詳細な説明】

[0001]

半導体装置の製造技術に関し、特に、半導体ペレットか らの放熱に配慮の必要な半導体装置の製造技術等に適用 して有効な技術に関する。

[0002]

【従来の技術】たとえば、日刊工業新聞社、1997年 3月1日発行、「表面実装技術」P2~P8等の文献に も記載されているように、半導体装置では、小型化、低 価格化と、入出力ピン数の増大、動作周波数の増加によ る発熱量の増大等に対処すべく、パッケージ構造の一部 10 を平坦な金属板等からなるヒートスプレッダで構成し、 半導体ペレットを、このヒートスプレッダに搭載して放 熱を行わせることが知られている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】ところが、半導体ペレ ットの発熱量が増大すると、平坦なヒートスプレッダで は放熱能力が不足し、実装される半導体ペレットの品種 等が制約を受ける懸念がある。

【0004】このため、たとえば、日経BP社、199 3年5月31日発行、実践講座VLSIパッケージング 部接続電極とを接続する複数のリードであることを特徴 20 技術、P205等の文献にも記載されているように、ヒ ートスプレッダの表面に、別部材の放熱フィンをネジ等 にて取り付けることにより、放熱量の向上を実現するこ とが考えられるが、構造が複雑になるため半導体装置の 製造原価が増大するとともに、厚さ寸法も増大する、と いう他の技術的課題を生じてしまう。

> 【0005】本発明の目的は、製造原価の低減と放熱性 能の向上とを両立させることが可能な半導体装置および 半導体装置の製造技術を提供することにある。

【0006】本発明の他の目的は、外形寸法の小型化と 30 放熱性能の向上とを両立させることが可能な半導体装置 および半導体装置の製造技術を提供することにある。

【0007】本発明の他の目的は、発熱量の大きな半導 体ペレットを安価かつ小型なパッケージ構造にて実装す ることが可能な半導体装置および半導体装置の製造技術 を提供することにある。

【0008】本発明の前記ならびにその他の目的と新規 な特徴は、本明細書の記述および添付図面から明らかに なるであろう。

[0009]

【課題を解決するための手段】本願において開示される 発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、 以下のとおりである。

【0010】本発明は、任意の機能を有する半導体ペレ ットを放熱部材に固定してなる半導体装置において、放 熱部材が凹凸形状を有する構造としたものである。

【0011】また、本発明は、任意の機能を有する半導 体ペレットを放熱部材に固定してなる半導体装置の製造 方法において、放熱部材に凹凸形状を形成する工程を含 むようにしたものである。

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面 を参照しながら詳細に説明する。

【0013】図1は、本発明の一実施の形態である半導 体装置の製造方法にて製造された半導体装置の構成の一 例を示す断面図であり、図2、本実施の形態の半導体装 置の製造方法の一例を示すフローチャートである。

【0014】本実施の形態の半導体装置Aは、略枠形状 のパッケージ基板1と、パッケージ基板1に形成された 複数の配線パターン1 aと、パッケージ基板1に支持さ れるヒートスプレッダ2(放熱部材)と、ヒートスプレ 10 のであれば、任意の形状でよい。 ッダ2に搭載された半導体ペレット3と、配線パターン 1 aに接続された複数の半田バンプ4と、複数の配線バ ターン1 aと半導体ペレット3上の図示しない複数のボ ンディングパッドとの間に個別に架設された複数のボン ディングワイヤ5と、半導体ペレット3を封止する樹脂 6、等で構成されている。

【0015】パッケージ基板1は、たとえばガラスエポ キシ樹脂等の絶縁物で構成され、各部の寸法は、一例と して厚さ寸法が2mm、外形寸法が50mm×50m m、程度である。配線パターン1aは、内端部が、枠形 20 状の内縁部に突設された段差部1 bに露出し、外端部 は、側面部に露出し、その上に半田バンプ4が配置形成 されている。

【0016】また、このパッケージ基板1に、たとえば 接着材等で固定されるヒートスプレッダ 2は、たとえば 厚さ寸法が1mm、外形寸法が30mm×30mm、程 度である。材質は、たとえば、加工性が良く、安価で、 熱伝導率の高い、たとえば銅 (Cu)、アルミニウム (A1) あるいはその合金で構成されている。

【0017】半田バンプ4は、径寸法が、たとえば1m 30 ェハ内に複数個が一括して形成され(ステップ30 m程度であり、たとえば500個程度、すなわち500 ピン程度の入出力端子数を確保できる。また、半導体ペ レット3は、上述の寸法例では、15mm×15mm程 度のサイズのものを使用できる。

【0018】この場合、ヒートスプレッダ2における半 導体ペレット3の搭載面と反対側の外部露出面には、凹 凸部2aが形成されており、別部材の放熱フィン等を必 要とすることなく、また実装面に対する投影面積を増大 させることなく、ヒートスプレッダ2それ自体での放熱 面積が大きくされている。図5は、本実施の形態のヒー 40 トスプレッダ2を取り出して例示した斜視図であり、同 図に例示されるように、凹凸部2 aは、たとえば、断面 が矩形の複数の溝を呈する。

【0019】このようなヒートスプレッダ2の凹凸部2 aは、たとえば、図3 (a)~(c)に例示されるよう に、対向面に任意の形状の凹凸型面100aが形成され たプレス型100とプレス型101との間にヒートスプ レッダ2を挟圧するプレス加工にて安価に形成すること ができる。その場合、凹凸部2aの形状は、凹凸型面1

ができる。

【0020】あるいは、図4に例示されるように、外周 部に任意の形状の凹凸パターン103aが形成された回 転するローレット103をヒートスプレッダ2に押し当 てることにより、当該ヒートスプレッダ2に凹凸パター ン103aに対応した凹凸部2aを形成してもよい。

4

【0021】なお、図1、図3、図4では、ヒートスプ レッダ2に形成される凹凸部2aは、図5に例示される 断面矩形の溝形状ものに限らず、表面積を大きくするも

【0022】たとえば、図6に例示されるような断面が 山型の凹凸部2b、図7に例示されるような断面が滑ら かな波型の凹凸部2c、あるいは、図8に例示されるよ うな孤立した多数のブロック状の凹凸部2d、あるい は、図9に例示されるような孤立した多数の円柱形の凹 凸部2e、あるいは、図10に例示されるように多数の 円柱形の穴からなる凹凸部2 f 等、任意の形状のものを 用いることができる。

【0023】ヒートスプレッダ2に対する上述のような 凹凸部2a~2fの形成は、上述のようなプレス加工や ローレット加工等に限らず、切削加工等で形成してもよ い。さらには、所望のパターンをマスクとするエッチン グ加工、レーザビームによる加工、等、任意の加工方法 を用いることができる。

【0024】以下、本実施の形態における上述のような 半導体装置Aの製造方法の一例を、図2のフローチャー トにて説明する。

【0025】半導体ペレット3は、たとえば、周知のフ ォトリソグラフィを用いるウェハプロセスにて半導体ウ

1) 、個々にプローブ等の検査を経た後(ステップ30 2)、ダイシングにて個別に分離されることにより(ス テップ303)、図1のようなチップ形状として組み立 て工程に供される。

【0026】一方、パッケージ基板1は、たとえば所望 の形状のガラス布基材をエポキシ樹脂等にて接着/積層 して形成され、銅箔等を表面に被着させたり内部に多層 構造に挟み込むことにより、配線パターン1 aが形成さ れる(ステップ304)。

【0027】一方、ヒートスプレッダ2は、たとえば、 上述のようなプレス加工等の任意の加工方法にて、たと えば、所定の形状の銅やアルミニウム等の薄板の一主面 に凹凸部2a~2fを形成することで制作される(ステ ップ305)。

【0028】そして、パッケージ基板1とヒートスプレ ッダ2とは、ヒートスプレッダ2の凹凸部2a~2fの 形成面を外側にして、たとえば接着等の方法にてパッケ ージに組み立てられる(ステップ306)。

【0029】なお、上述のステップ301~303のペ

.

製造工程、ステップ305のヒートスプレッダ2の製造工程の各々は、任意に並行して進めることができ、互いの順序関係は任意である。

【0030】次にステップ306で得られたパッケージのヒートスプレッダ2の内側の平坦な面に対して、ペレットボンディングにより、所望の導電性接着材等を用いて半導体ペレット3を固定する(ステップ307)。

【0031】その後、半導体ペレット3の複数のボンディングパッドと、パッケージ基板1の配線パターン1aの対応する複数の内端部との間に個別に金線等の導体か 10 らなるボンディングワイヤ5を架設するワイヤボンディングを行う(ステップ308)。

【0032】次に、パッケージ基板1の内部に位置する 半導体ペレット3を、ポッティング等の方法で樹脂6に て封止する(ステップ309)。

【0033】その後、パッケージ基板1の外面部に露出している配線パターン1aの外端部の各々に、半田バンプ4を突設して形成する(ステップ310)。

【0034】このような方法にて、製造された本実施の 形態の半導体装置Aは、半田バンプ4を介して、所望の 20 実装対象物に対して表面実装される。

【0035】そして、稼働中の半導体装置Aの半導体ペレット3から発生する熱は、ヒートスプレッダ2の外面に形成された凹凸部2a~2fによる広い放熱面積を介して外部に効率良く放散される。

【0036】また、放熱フィン等の余分の部品を装着しないので、実装面からヒートスプレッダ2における凹凸部2a~2fの形成面までの高さ寸法が増大せず、半導体装置Aの小型化、すなわち実装スペースの削減を実現できる。

【0037】なお、半導体装置の構造としては、図1に 例示したパッケージ基板を用いる組み立て構造に限らず、以下のような、TAB (Tape Automated Bonding)テープによる組み立て構造を有するものにも適用できる。

【0038】すなわち、図11は、本実施の形態における半導体装置の変形例を示す断面図である。この図11に例示される半導体装置Bは、ポリイミド樹脂等の絶縁物からなる枠状のテープ基材10aと、このテープ基材10aの一主面に放射状に形成された金属箔等からなる複数のリード10bと、このリード10bと反対側のテープ基材10aの主面に被着されたサポートリング10 c等で構成されるTABテープ10のリード10bの先端部に対して、半導体ペレット3の図示しないボンディングパッドを一括してボンディングした後、外面に凹凸部2a~2f等が形成されたヒートスプレッダ2を接着材にてサポートリング10cおよび半導体ペレット3に被着固定した構造となっている。また、複数のリード10bの基端部側には、複数の半田バンプ11が個別に被

ティング等の方法で樹脂12にて封止されている。

【0039】各部の寸法は、一例として、テープ基材1 0aおよびサポートリング10cの厚さは、それぞれ1 25 μ m、リード10bは厚さが35 μ m、半田バンプ 11は外径が500 μ m、ヒートスプレッダ2の厚さ は、この場合、1000 μ m以下、であり、全体の厚さ は、2mm以下である。

【0040】このように、図11の半導体装置Bの場合には、TABテープ10を用いることにより、図1のパッケージ基板を用いる構成の場合よりもさらに薄型化、低コスト化が可能であるが、その場合にも、ヒートスプレッダ2自体に凹凸部2a~2f等を形成することにより、TABテープ10の採用による薄型寸法を維持したままで放熱性能を向上させることができ、ヒートスプレッダ2における放熱性能による制約によって、半導体ペレット3の品種等が制約を受ける懸念がない。したがって比較的高い発熱量の半導体ペレット3を、薄い小型のパッケージ形態にて実装できる、という効果が得られる

)【0041】図12は、TABテープを用いた変形例を 示す半導体装置Cの構成の一例を示す断面図である。こ の図12の場合には、TABテープ20が、テープ基材 20aの表裏両面にリード20bおよびテープ基材20 aを貫通して当該リード20bに電気的に接続された導 体パターン20cを形成した構造を呈しており、リード 20bの先端部は、半導体ペレット3の側に設けられた 半田バンプ3aを介してCCB接続されている。

【0042】サポートリング20dは、接着材層20eを介してリード20bの上に被着され、さらに、このサ30ポートリング20dの上に、接着材層20fを介して、その中央部が半導体ペレット3に固定され凹凸部2a~2fにて放熱を行うヒートスプレッダ2の周辺部が固定されている。

【0043】また、半田バンプ21は、TABテープ2 0のリード20bとは反対側の導体パターン20c上に 配置形成されている。半導体ペレット3は、ポッティン グされた樹脂22にて封止されている。

【0044】この図12の半導体装置Cの場合には、TABテープ20がリード20bおよび導体パターン20 c等の複数の導体層を積層した構成であるため、半導体ペレット3から半田バンプ21に至る信号経路のインピーダンス整合やインダクタンスの低減等の電気的な特性の多様な設定が可能であり、ヒートスプレッダ2に形成された凹凸部2a~2fによる放熱性能の向上と合わせて、より多様な機能の半導体ペレット3の実装が可能になる、という利点がある。

【0045】以上本発明者によってなされた発明を実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発明は前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しな

【0046】たとえば、外部接続電極は、半田バンプ等 に限らず、たとえば挿入実装タイプのピンを突設した構 造であってもよい。さらに、ヒートスプレッダの材質 は、金属等に限らず、たとえば金属粉を混和することで 熱伝導率を向上させた樹脂やセラミックス等であっても IW.

[0047]

【発明の効果】本願において開示される発明のうち、代 表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば、 以下のとおりである。

【0048】本発明の半導体装置によれば、製造原価の 低減と放熱性能の向上とを両立させることができる、と いう効果が得られる。

【0049】また、本発明の半導体装置によれば、外形 寸法の小型化と放熱性能の向上とを両立させることがで きる、という効果が得られる。

【0050】また、本発明の半導体装置によれば、発熱 量の大きな半導体ペレットを安価かつ小型なパッケージ 構造にて実装することができる、という効果が得られ

【0051】また、本発明の半導体装置の製造方法によ れば、製造原価の低減と放熱性能の向上とを両立させる ことができる、という効果が得られる。

【0052】また、本発明の半導体装置の製造方法によ れば、外形寸法の小型化と放熱性能の向上とを両立させ ることができる、という効果が得られる。

【0053】また、本発明の半導体装置の製造方法によ れば、発熱量の大きな半導体ペレットを安価かつ小型な パッケージ構造にて実装することができる、という効果 が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施の形態である半導体装置の製造 方法にて製造された半導体装置の構成の一例を示す断面 図である。

【図2】本発明の一実施の形態である半導体装置の製造 方法の一例を示すフローチャートである。

【図3】(a)~(c)は、本発明の一実施の形態であ る半導体装置の製造方法におけるヒートスプレッダの加 工方法の一例を工程順に例示した概念図である。

【図4】本発明の一実施の形態である半導体装置の製造 40 20 e 接着材層 方法におけるヒートスプレッダの加工方法の一例を工程 順に例示した概念図である。

【図5】本発明の一実施の形態である半導体装置の製造 方法にて製造された半導体装置の放熱部材を取り出して 例示した斜視図である。

【図6】本発明の一実施の形態である半導体装置の製造 方法にて製造された半導体装置の放熱部材を取り出して 例示した斜視図である。

【図7】本発明の一実施の形態である半導体装置の製造

方法にて製造された半導体装置の放熱部材を取り出して 例示した斜視図である。

【図8】本発明の一実施の形態である半導体装置の製造 方法にて製造された半導体装置の放熱部材を取り出して 例示した斜視図である。

【図9】本発明の一実施の形態である半導体装置の製造 方法にて製造された半導体装置の放熱部材を取り出して 例示した斜視図である。

【図10】本発明の一実施の形態である半導体装置の製 10 造方法にて製造された半導体装置の放熱部材を取り出し て例示した斜視図である。

【図11】本発明の一実施の形態である半導体装置の製 造方法にて製造された半導体装置の変形例を示す断面図

【図12】本発明の一実施の形態である半導体装置の製 造方法にて製造された半導体装置の変形例を示す断面図 である。

【符号の説明】

- 1 パッケージ基板(枠構造)
- 20 1a 配線パターン(配線構造)
 - 1b 段差部
 - 2 ヒートスプレッダ(放熱部材)
 - 2a~2f 凹凸部
 - 3 半導体ペレット
 - 3a 半田バンプ
 - 4 半田バンプ (外部接続電極)
 - 5 ボンディングワイヤ(配線構造)
 - 6 樹脂
 - 10 TABテープ (枠構造)
- 30 10a テープ基材
 - 10b リード (配線構造)
 - 10c サポートリング
 - 11 半田バンプ (外部接続電極)
 - 12 樹脂
 - 20 TABテープ (枠構造)
 - 20a テープ基材
 - 20b リード (配線構造)
 - 20c 導体パターン (配線構造)
 - 20d サポートリング
- - 20f 接着材層
 - 21 半田バンプ (外部接続電極)
 - 22 樹脂
 - 100 プレス型
 - 100a 凹凸型面
 - 101 プレス型
 - 103 ローレット
 - 103a 凹凸パターン
 - A, B, C 半導体装置

200

